

Fachausschuss-Sitzung und Workshop „Schicht- und Oberflächencharakterisierung“

Termin und Ort:

15. Oktober 2026 von 13.30 – 17.00 Uhr

JOANNEUM RESEARCH, MATERIALS – Institut für Sensorik, Photonik und
Fertigungstechnologien, Surface Characterization Lab, Franz-Pichler-Straße 30, 8160 Weiz

Come Together ab 13:00 Uhr

Tagesordnungspunkte

- ▶ **Begrüßung** und Hinweis auf die
LEITLINIEN ZUR EINHALTUNG KARTELLRECHTLICHER VORSCHRIFTEN
Ulrich Trog und **Wolfgang Waldhauser**
- ▶ **Kurzvorstellung der Teilnehmer*innen**
- ▶ Vorstellung **Surface Characterization Lab**
Philipp Schöffner (JOANNEUM RESEARCH)
- ▶ Vortrag „**Rasterkraftmikroskopie (AFM) und deren Einsatzmöglichkeiten**“
Philipp Schöffner (JOANNEUM RESEARCH)
- ▶ Vortrag „**Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS) und Ellipsometrie -
Einsatzmöglichkeiten**“
Alexander Fian (JOANNEUM RESEARCH)
- ▶ Vortrag „**Mikro- und Nanoindentation zur mechanischen Schichtcharakterisierung**“
Richard Ruf (Anton Paar GmbH)
- ▶ Vortrag „**Durchstrahlungselektronenmikroskopie und deren Einsatzmöglichkeiten**“
Gerald Kothleitner (FELMI-ZFE)
- ▶ Vorstellung **Europäische Forschungsgesellschaft Dünne Schichten e.V. (EFDS)**
Udo Klotzbach (EFDS)
- ▶ **Laborbesichtigung**
Philipp Schöffner und Alexander Fian
- ▶ **Schlussworte und Ausklang**



Mit besten Grüßen
Wolfgang Waldhauser
FA Obmann

Wir bitten um verbindliche Anmeldung bis zum 01.10.2026 unter:

<https://forms.cloud.microsoft/e/Dc6iHKmVwN> **oder QR-Code!**

FA Advanced Surface Engineering -
“Schichtcharakterisierung”

